2021-12-08 第10回 可視赤外線観測装置技術ワークショップ 2021 国立天文台三鷹



複屈折結晶を用いた 極限補償光学用波面センサの開発

津久井遼(京大理D2)

協同研究者:木野勝,山本広大,栗田光樹夫(京大理),松谷晃宏(東工大OFC)



- 研究背景
- 波面センサの原理と設計
- 製作と評価の現状



- 研究背景
- 波面センサの原理と設計
- 製作と評価の現状

目的と要請

- サイエンス:
 - •惑星形成メカニズムの解明
 - •太陽系外での生命探査
 - → **太陽系外惑星の直接観測** (可視-近赤外)
- 系外惑星は
 - 恒星との離角: ~0.1"-0.01"
 - 恒星との光度比: ~5-8桁 (高コントラスト)
- ・恒星近傍での

高コントラスト観測が必要



恒星からの離角(arcsec)

地球型惑星の分布(Guyon+2018) 塗りつぶし:TMTでの目標天体



- ・地球大気には屈折率ムラが存在
 →光波面の乱れ
 - →恒星光由来のスペックル(光斑)

→コントラストを制限

- ・屈折率ムラは風で流されていく
 →波面の乱れも時間変化
 (変動タイムスケール~1 msec)
- 安定的に高コントラストを得るには
 リアルタイムな波面の補償が必要



極限補償光学(ExAO: Extreme Adaptive Optics)

- 波面補償によりスペックルを抑圧
 - 高精度 (<λ/20~80 nm)
 - リアルタイム (>1000回/sec)
- 様々な誤差要素:
 - 波面センサの測定誤差
 - 補償のタイムラグ →波面乱れの残存
 - →**スペックルの残存** →コントラストの制限(~4桁)
- ・現状:各誤差要素を低減したい



3/17

極限補償光学の概念図

- 主要な誤差要素: (1)波面センサの測定誤差 (2)補償のタイムラグ
- これらはトレードオフ 例: (2) ラグを減らす →高頻度測定 →フォトン減る →(1)測定誤差増える
- 両方を減らすには 高効率な波面センサが必要



4/17

ExAOの各誤差要素によるスペックル強度 (Guyon 2018) 口径8 m, SHWFS@1 kHz



- 研究背景
- 波面センサの原理と設計
- 製作と評価の現状

測定原理:位相シフト干渉法

- 高効率を得やすい
- •3種類の干渉縞(0, ±120 deg)から、被検波面の形状を計算



・必要なもの:参照波面、3種類の位相シフト



- ・点回折素子のピンホールにより
 - 参照波面を生成
 - ・位相シフトを設定可能、ただし1通り
 →縮退

★被検波面 参照波面 (球面波) 被検波面 望遠鏡 点回折素子(ガラス)

断面形状





- ・点回折素子のピンホールにより
 - 参照波面を生成
 - ・位相シフトを設定可能、ただし1通り
 →縮退







- ・点回折素子のピンホールにより
 - 参照波面を生成
 - ・位相シフトを設定可能、ただし1通り
 →縮退

★被検波面 参照波面 (球面波) 被検波面 望遠鏡 点回折素子(ガラス)

断面形状





•3通りの位相シフトを作るため、点回折素子に**複屈折結晶(TiO2**)を利用





・ 複屈折性と表面での鏡面反射を利用
 → 1台で3通りの位相シフトを作る



光路	ピンホール内外の光路差	位相シフト
透過, 偏光方向x	$(n-n_o)d$	$\simeq -120 \text{ deg}$
透過, 偏光方向y	$(n-n_e)d$	$\simeq -240 \text{ deg} = 120 \text{deg}$
反射	0(鏡面反射)	0 deg



・ 複屈折性と表面での鏡面反射を利用
 → 1台で3通りの位相シフトを作る



光路	ピンホール内外の光路差	位相シフト
透過, 偏光方向x	$(n-n_o)d$	$\simeq -120 \text{ deg}$
透過, 偏光方向y	$(n-n_e)d$	$\simeq -240 \text{ deg} = 120 \text{ deg}$
反射	0(鏡面反射)	0 deg



・ 複屈折性と表面での鏡面反射を利用
 → 1台で3通りの位相シフトを作る



光路	ピンホール内外の光路差	位相シフト
透過, 偏光方向x	$(n-n_o)d$	$\simeq -120 \text{ deg}$
透過, 偏光方向y	$(n-n_e)d$	$\simeq -240 \text{ deg} = 120 \text{ deg}$
反射	0(鏡面反射)	0 deg

ピンホール径の最適設計

・測定誤差はピンホール径に依存
 ・ ジェールオ く 参照波面の乱れ大 → 誤差大
 ・ デ渉縞のコントラスト(S/N)大 → 誤差小

→効率最大化(誤差最小化)には最適設計が必要

 ・シミュレーションにより測定誤差を予測
 → ピンホール直径を30µmに決定 (エアリーディスクの1/2)

・標準的な他方式と比較
 → 同一フォトン数の下で高精度
 → 高効率

※ツェルニケ波面センサより測定レンジ大



9/17

ピンホール径の最適設計

・測定誤差はピンホール径に依存
 ・ ジェールオ く 参照波面の乱れ大 → 誤差大
 ・ デ渉縞のコントラスト(S/N)大 → 誤差小

→効率最大化(誤差最小化)には最適設計が必要

 ・シミュレーションにより測定誤差を予測
 → ピンホール直径を30µmに決定 (エアリーディスクの1/2)

・標準的な他方式と比較
 → 同一フォトン数の下で高精度
 → 高効率

※ツェルニケ波面センサより測定レンジ大



9/17



- 研究背景
- 波面センサの原理と設計
- 製作と評価の現状

以降、非公開